

PCT

REC'D 17 MAR 2005

WIPO

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

(法第12条、法施行規則第56条)

[PCT 36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 F-1101	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP2004/001550	国際出願日 (日.月.年) 13.02.2004	優先日 (日.月.年) 18.02.2003	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> H01L 21/66, G01R 1/06, H01R 11/01			
出願人 (氏名又は名称) JSR株式会社			

1. この報告書は、PCT 35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。  
法施行規則第57条（PCT 36条）の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。
3. この報告には次の附属物件も添付されている。
- a ☐ 附属書類は全部で \_\_\_\_\_ ページである。
- ☐ 補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙（PCT規則70.16及び実施細則第607号参照）
- ☐ 第I欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙
- b ☐ 電子媒体は全部で \_\_\_\_\_ （電子媒体の種類、数を示す）。  
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。（実施細則第802号参照）

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- |                                     |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 第Ⅰ欄 | 国際予備審査報告の基礎   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 第Ⅱ欄 | 優先権   |
| <input type="checkbox"/>            | 第Ⅲ欄 | 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不成                        |
| <input type="checkbox"/>            | 第Ⅳ欄 | 発明の単一性の欠如   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 第Ⅴ欄 | PCT 35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 |
| <input type="checkbox"/>            | 第Ⅵ欄 | ある種の引用文献  |
| <input type="checkbox"/>            | 第Ⅶ欄 | 国際出願の不備   |
| <input type="checkbox"/>            | 第Ⅷ欄 | 国際出願に対する意見  |

国際予備審査の請求書を受理した日 08.09.2004	国際予備審査報告を作成した日 01.03.2005		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員)  橋本 憲一郎	4R	3031
電話番号 03-3581-1101 内線 3469			

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2004年1月)

## 第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎とした。

それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査  
☐ PCT規則12.4にいう国際公開  
☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

\* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

## 第Ⅱ欄 優先権

1. ☐ この報告は、次の書類が所定の期間内に提出されなかったため、優先権の主張がされなかったものとして作成した。
- ☐ 優先権の主張の基礎となる先の出願の写し (PCT規則66.7(a))
- ☐ 優先権の主張の基礎となる先の出願の翻訳文 (PCT規則66.7(b))
2. ☐ この報告は、優先権の主張が無効であると認められるので、優先権の主張がされなかったものとして作成した。  
(PCT規則64.1)

したがって、この国際予備審査報告書においては、上記国際出願日を基準日とする

3. ☒ 追加の意見 (必要ならば)

請求の範囲4に記載された発明は、優先権主張の基礎とされた特願2003-040026には記載されていない。

したがって、請求の範囲4に記載された発明については、優先権の主張を認めず、上記国際出願日を基準日とする。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 4	有 無
	請求の範囲 1-3, 5-10	
進歩性 (IS)	請求の範囲	有 無
	請求の範囲 1-10	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-10	有 無
	請求の範囲	

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 2002-324600 A(ジェイエスアール株式会社), 2002. 11. 08  
文献2: JP 2003-77962 A(ジェイエスアール株式会社), 2003. 03. 14

請求の範囲1-3, 5-10に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から新規性及び進歩性を有さない。

文献1の第19-68, 77段落及び第1-11図には、複数の異方導電膜配置用孔が形成されたフレーム板と、この異方導電膜配置用孔に配置され、導電性粒子が含有された複数の導電部が絶縁部によって絶縁されている異方導電膜とからなる異方導電性コネクタが開示されている。また、文献1には、異方導電膜における突出部は必須ではなく、一面または両面が平坦でも良いことが開示されているから、文献1に開示された発明と、請求の範囲1-3, 5-10に記載された発明は同一である。

請求の範囲4に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1及び2から進歩性を有さない。

文献1には、異方導電膜において、突出部の高さは10%以上(すなわち、比 $T2/T1$ が約0.9以下)が好ましいが、突出部がなくても良い(すなわち、比 $T2/T1$ が1)ことが開示されているから、文献1に開示された発明において、比 $T2/T1$ が約0.9~1となる範囲で突出部の高さを適宜調整することは、当業者であれば容易になし得たことである。

また、文献1には、異方導電膜の機能部の面積の総和 $S1$ と、検査対象であるウエハにおける被検査電極が形成された側の表面の面積 $S2$ との比 $S1/S2$ が、いかなる値であるか明記されていない。

しかし、文献1に開示された発明において、異方導電膜の総面積とチップ全体の面積との比は約0.3以下であると認められ(第7図を参照)、また、フレーム板の貫通孔に異方導電膜を形成した異方導電性コネクタにおいて、接続用導電部の面積と貫通孔の面積の比は、一般に、0.02~0.5程度である(例えば、文献2の第37段落を参照)から、文献1に記載された発明において、比 $S1/S2$ の値は、0.001~0.3程度であると認められる。